

Doc.No : NR011129

2001年11月29日

低価格、コンパクトなウエハ膜厚測定装置「VM-1200」シリーズを発売

大日本スクリーン製造株式会社(本社：京都市上京区/社長：石田 明)は、低価格でコンパクトなデスクトップ型の光干渉式膜厚測定装置「VM-1200」シリーズ4機種を12月5日から販売します。

今回発売するシリーズは、ウエハ上の膜厚の干渉色を分光する原理にもとづき、非接触、非破壊で高速・高精度に測定できるラムダエースVMシリーズのエコノミータイプ。顕微鏡とモニターを一体化したワンボックス・デスクトップ仕様で省スペース化を実現しました。厚さが1ナノメートルの超薄膜にも対応できるUV光源や複数ポイントの自動測定を可能にするオートステージ(共にオプション)といった当社上位機種レベルの優れた拡張機能を有しています。また、オートフォーカスや電動レボルバ(対物レンズ)、フォトレジスト(感光液)を感光させないためのフィルターを自動装填できる機能を搭載するなど、操作性も大幅に向上させました。

ウエハに形成される膜は半導体の微細化技術の進歩とともに多様化していますが、この装置ではレジスト、シリコン酸化膜、ポリイミドなど各種の膜に対応した膜厚測定が可能で、最大4層膜までの積層膜同時測定、屈折率測定ができます。測定データは平坦結像型ホログラフィック凹面回折格子と1次元CCDイメージセンサーで正確に再現。OSにはWindows NTを採用しており、各種データの2次加工や測定プログラムのユーザー定義、LANを介してネットワークへの接続(オプション)などにも対応しています。また、ウエハのみならず、ガラスなど各種基板にも使用できます。

< 販売価格 >

780万～1630万円(仕様により異なる)

< 年間販売台数 >

30台

< 販売開始日 >

2001年12月5日



VM1200

●本件についてのお問い合わせ先

大日本スクリーン製造株式会社 本社広報室：Tel 075-414-7131 Fax 075-431-6500 〒602-8585 京都市上京区堀川通寺之内上ル4丁目

<仕様>

ウエハサイズ : 50mm、 75mm、 100mm、 125mm、 150mm、 200mm
機能 : 25種類の膜厚測定(UV光源搭載機29種)、 分光反射率測定、 屈折率測定、
測定膜種のユーザー登録、 測定データの3Dマッピング出力および統計出力、
積層同時測定ソフト(4層膜まで)、 エッチレート計算

VM-1200、 1210

測定領域 : 5 μm (10 X 対物レンズ)
2.5 μm (20 X 対物レンズ)
10 μm (5 X 対物レンズ)
1 μm (50 X 対物レンズ)(オプション)
膜厚測定範囲 : 10nm ~ 20 μm (SiO_2 on Siを10 X 対物レンズで測定時)
測定時間 : 1秒以下(SiO_2 on Siを10 X 対物レンズで測定時)
測定再現性() : 0.1nm(膜厚が10nm ~ 3,000nmの場合)
0.03%(膜厚が3 μm ~ 20 μm の場合)

VM-1220、 1230(UV光源搭載機)

測定領域 : 7 μm (15 X 対物レンズ)
2 μm (50 X 対物レンズ)
膜厚測定範囲 : 1nm ~ 20 μm (SiO_2 on Siを15 X 対物レンズで測定時)
測定時間 : 1秒以下(SiO_2 on Siを15 X 対物レンズで測定時)
測定再現性() : 0.1nm(膜厚が5nm ~ 3,000nmの場合)
0.03%(膜厚が3 μm ~ 20 μm の場合)